

# S230H Series

Automated Test Equipment

## PDPドライバICテストシステム

## PDP Driver IC Test System

### 概要

S230は、PDP（プラズマディスプレイパネル）のドライバICの測定を目的としたテストシステムで、ドライバICテスト市場では圧倒的なシェアを誇り、デファクトスタンダードとなっています。

このS230の仕様をアップグレードさせ、市場の高電圧ピンの増加要求に応えたのがS230Hです。S230Hは、高電圧出力のDataドライバさらにScanドライバまで、すべてのPDPドライバICのフルテストに対応できるシステムです。試験内容により内部モジュール構成を自由に選択でき、大きな拡張性を持っています。

またテストヘッドはTCPハンドラ、QFPハンドラおよびウェーハプローバとの接続が容易で、ウェーハプロービングテストからTCPでの量産テストまで幅広く使用することができます。



### 特長

- 最大ピン数は576ピンで、256 OUTピンの2個同時測定を実現 (RSDSにも対応)。最大同時測定個数は4個まで可能。
- 多チャンネル搭載されたハイボルテージメジャーユニット (HVMU) を使用してDC測定を短時間で実行可能。
- 最大800 mAまで電流印加でき、大電流を必要とするデバイスに対応。
- ハイボルテージソース (HVS) 出力に過電流防止回路を組み込み、デバイス出力の短絡などによる過電流を抑え、高い安全性と信頼性を確保。
- RSDSオプション搭載により、低振幅インタフェースに対応。

### 規格

- デジタルI/Oピン 最大 64 ピン (-2 V ~ +8 V)
- ハイボルテージOUTピン  
最大 512 ピン (125 V/250 Vレンジ)
- ファンクションテストレート  
20/40/60 MHz (RSDS時 83.3 MHz)
- DC ボルトメータ 2入力  
±32 V max. (Single, direct input)  
±64 V max. (Diff., direct input)  
±512 V max. (Diff., ATT. input)
- V/Iソース ±128 V/±250 mA (±40 V/±2 A)
- ハイボルテージソース (HVS)  
-5 V ~ +250 V/±400 mA  
(2台並列接続にて±800 mAまで対応)
- ハイボルテージ測定ユニット (HVPMU)  
-5 V ~ +250 V/±32 mA
- 同時測定数 1/2/4 DUTs

### ターゲットデバイス

PDPドライバIC (Dataドライバ、Scanドライバ)

S230H.1.01.YO

# S230 Series

Automated Test Equipment

## PDPドライバICテストシステム

## PDP Driver IC Test System

### 概要

S230は、PDP (プラズマディスプレイパネル) のドライバICの測定を目的としたテストシステムで、ドライバICテスト市場では圧倒的なシェアを誇り、デファクトスタンダードとなっています。

S230は、高電圧出力のScanドライバおよびDataドライバのすべてのPDPドライバICのフルテストに対応できるシステムで、試験内容により内部モジュール構成を自由に選択でき、大きな拡張性を持っています。

またテストヘッドはTCPハンドラ、QFPハンドラおよびウェーハプローバとの接続が容易で、ウェーハプロービングテストからTCPでの量産テストまで幅広く使用することができます。



### 特長

- 最大ピン数は512ピンで192 OUTピンの2個同時測定を実現 (RSDSにも対応)。最大同時測定個数は4個まで可能。
- 多チャンネル搭載されたハイボルテージメジャーユニット (HVMU) を使用してDC測定を短時間で実行可能。
- 最大800 mAまで電流印加でき、大電流を必要とするデバイスに対応。
- ハイボルテージソース (HVS) 出力に過電流防止回路を組み込み、デバイス出力の短絡などによる過電流を抑え、高い安全性と信頼性を確保。
- RSDSオプション搭載により、低振幅インタフェースに対応。

### 規格

- デジタルI/Oピン 最大 128 ピン (-2 V ~ +8 V)
- ハイボルテージOUTピン  
最大 384 ピン (125/250 Vレンジ)
- ファンクションテストレート  
20/40/60 MHz (RSDS時、83.3 MHz)
- DC ボルトメータ 2入力  
±32 V max. (Single, direct input)  
±64 V max. (Diff., direct input)  
±512 V max. (Diff., ATT. input)
- V/Iソース ±128 V/±250 mA (±40 V/±2 A)
- ハイボルテージソース (HVS)  
-5 V ~ +250 V/±400 mA  
(2台並列接続にて±800 mAまで対応)
- ハイボルテージ測定ユニット (HVPMU)  
-5 V ~ +250 V/±32 mA
- 同時測定数 1/2/4 DUTs

### ターゲットデバイス

PDPドライバIC (Dataドライバ、Scanドライバ)

S230.1.01.YO